This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02199813

"UBLICATION DATE

08-08-90

APPLICATION DATE

30-01-89

APPLICATION NUMBER

01017690

APPLICANT: CANON INC;

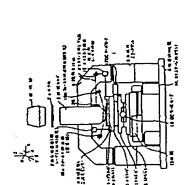
INVENTOR: TOKUDA YUKIO;

INT.CL.

H01L 21/027 F16F 15/02 G03F 7/20

TITLE

ALIGNER



ABSTRACT: PURPOSE: To prevent this aligner from being vibrated by means of a compact constitution by installing separate vibration-proof mounts which respectively support a stage on which a substrate is placed and a projection-lens mounting base which holds a projection lens.

> CONSTITUTION: An origin is decided by the use of a laser beam from a laser head 21 and a two-dimensional sensor 8; after that, a shot arrangement and a shaft amount in an X-Y direction are previously input to a computer 41 for each semiconductor wafer to be exposed to light. A drive command of a motor 46 is given to a servomotor 45; a drive command of a valve 49 is given to a pressure controller inside a controller 48. Then, a drive command of a motor 50 is given to a voice-coil motor driver on the basis of data from an accelerometer 51 on a surface plate 13. Then, θ (yawing), α (rolling) and β (pitching) as differences between data from a focus-detection part 53 and a laser measuring system 44 and a prescribed layout are computed. Then, a command is given to the driver 45 regarding an X-Y component and to a driver for top-stage drive use regarding θ , α and β components; the motor 46 and a stage 47 are driven so as to coincide with the prescribed layout. Thereby, an active inverter can be made small-sized and a cost can be reduced.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-199813

Int. Cl. 5

識別記号

521

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)8月8日

H 01 L F 16 F G 03 F 21/027 15/02

L

6581-3 J 6906-2H 7376-5 F

7376-5 F

H 01 L 21/30

Z 301

審査請求 未請求 請求項の数 4

(全7頁)

60発明の名称 露光装置

> 顧 平1-17690 20特

平1(1989)1月30日 22出 頭

個発 明 者 夫 徳 田

神奈川県川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社

小杉事業所内

キヤノン株式会社 创出 願

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

9代 理 哲也 外1名 弁理士 伊東

1. 発明の名称

露 光 装

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 原板上に形成されているパターンを投影 レンズを介してステージ上に載置された基板に露 光する露光装置において、

上記基板を載置するステージと上記投影レンズ を保持する投影レンズ取付台とをそれぞれ支持す る別々の防振マウントを具備することを特徴とす る露光装置。

- (2)前記ステージ全体の傾きを補正してステ ージ移動後の全体姿勢を一定に保つように、前記 別置きされたステージ用の防振マウントの空気圧 をステージ移動完了前にコントロールする手段を 備えた請求項1に記載の露光装置。
- (3) 前記ステージ用の防振マウントの空気圧 コントロールデータを、1枚前の基板処理時のス テージ位置データおよびステージ全体の傾きデー タに基づいて補正する手段を備えた請求項2に記

載の露光装置。

- (4) 前記ステージ用の防振マウントがアクテ ィブダンパである鯖求項3に記載の露光装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体素子製造等に用いられる露光 装置に関し、群しくは基板を載置するステージと 投影レンズ搭載部位とを支持する構造体をそれぞ れ別置きとした露光装置に関する。

(従来の技術)

従来、半導体素子製造に用いられる露光装置と して、いわゆるステッパと呼ばれる装置が知られ ている。このステッパは、基板例えば半導体ウエ ハを投影レンズ下でステップ移動させながら、原 板例えばレチクル上に形成されているパターン像 を投影レンズで縮小し、1枚のウエハ上の複数箇 所に順次露光して行くものである。

ステッパは、解像度および重ね合せ精度の性能 面からこれらのアライナ(露光装置)の主流と見 られている。

第5図は、従来のアライナにおける構造体およびXYステージの搭載例を示す。

同図のは、1はレチクルバターンを開いて、1はレチクルバターンを用いて、1はレチクルバターンを有になる。ないでは、2 サイン・スターンスを力になる。ないでは、2 サイン・スターンスを力がある。 1 6 ものから、1 6 ものがのが、1 6 ものが、1 6 ものが、1

このような構成のアライナで処理される半導体 ウエハについては、半導体素子の大面積化および コスト低減を図るために、大口径・大サイズの半 導体ウエハを用いる傾向にある。現在、ウエハサ

る重量増加分よりさらに増大せざるを得ない。 そのため、ステージ移動の加速度による加振力の増大と投影レンズの重量の増加によるレンズ支持の 構造体の相対剛性ダウンによる振動問題が生じ、 そのために以下のような問題点が発生する。

①構造体強化による装置の大型化およびコストアップが生じる。

②構造体制振まで露光およびアライメント動作を行なえないため、生産性がダウンする。

b) 一方、ステージの重量増は静的には移動荷 重の増大となり、XYステージのポジションによ り装置の姿勢が変化するという問題が生じる。そ のため、以下のような問題点が発生する。

①アライメント特度が劣化する。

②生産性のダウンを防止するため、装置姿勢を瞬時に一定姿勢にする必要がある。そのために第5図の従来構成においてサーボマウント能力を向上する必要があり、コストアップにつながる。

③重量増大した装置全体を一定姿勢にするた

イズは φ 6 ′ (φ 1 5 0 m m) が主流であるが、 1 9 8 9 年頃には φ 8 ′ (φ 2 0 0 m m) が主流 となるものと見込まれる。

一方、半導体素子(特に D R A M)は 4 M (メガ)ピット時代から 1 6 M (メガ)ピット時代へと高集積化が進み、線巾も微梱化している。 したがって、より高精度の位置合せ、高精度の X Y ステージ、高スループット等が切望されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、従来のする、~する、用露光装置を単にする、用にサイズアップしXYステージを第5図の支持定盤61に直接固定する従来のステッパの構造によれば以下のような問題点が生じる。

a) X Y ステージ 8 、 1 0 、 1 1 のストローク アップのため、ステージの精度としてストローク 前のものと同じ精度またはそれ以上の精度を保証 するためには、ガイド関性を上げる必要がある。 また、前記した高精度ステージの要求を満たすた めに、ステージ重量は単にストロークアップによ

め、サーポマウントの能力を向上する必要が あり、サーポマウントの大型化が必要とな る。したがって、装置全体の高さが増す。

c) 第5 図に示すような従来形の X Y ステージ 支持構造によれば、 X Y ステージ以外の可動部位 が動作した時に、 X Y ステージを加振する問題が 生じる。そのため、

①アライメント精度の劣化、

②焼付精度の劣化、

等の問題が発生する。

本発明は、上述の従来形の問題点に鑑み、コンパクトな構成で装置の振動防止を実現し、安価かつ高精度で高スループットの露光装置を構成することを目的とする。

(課題を解決するための手段および作用)

前記の目的を達成するため、本発明は、XYステージと本体特に鏡筒支持体とをそれぞれ別々のマウントで支持する構造とし、XYステージ移動による本体振動を防止することを特徴とする。

かかる構成によれば、XYステージと鏡筒支持

体とをそれぞれ別々のマウントで支持しているので、XYステージ移動による振動が鏡筒支持体を含む本体に与える影響を最小限とすることができる。

(実施例)

以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。

第1図〜第4図は、本発明の一実施例に係る露 光装置を示す。第1図は、本発明の特徴を最もよ く表わす実施例の装置の側面図(一部は透視して 表わしている)である。

同図において、1はレチクルを照明する照明 部、2は転写すべきパターンを有するレチクル、 3はレチクル上に形成されたパターンを ウエハ上 に投影する投影レンズ、4は投影レンズを支持する 金銭筒支持体、5は鏡筒支持体4を支持するエアーマウント、6はエアーマウント5とステージ用 マウント14との相対位置決め定盤である。 7、8はXYステージの原点を決定するXY方向

の焦点位置とウエハ上面間の距離を計測するフォーカス検出部の投光部である。これらの投光部16aと受光部16bは、それぞれ投影レンズ3に固定されている。17はXステージ10をX方向に移動させるための駆動用DCサーボモータである。動きせるための駆動用DCサーボモータである。

第2図は、本実施例の露光装置のXYステージ 用測定系の配置を示す斜視図であり、第1図のトップステージ9の周辺のレーザ干渉計15等の部 分を詳細に表わした図である。

同図において、21は光源であるレーザーヘッド、22は第1図のトップ(8-2およびティルト)ステージ9に取り付けられた反射ミラー、23はレーザ干渉計、24は干渉稿を電気信号に変換するレシーバ、25は第1図の投影レンズ3と同一の投影レンズ、26は投影レンズ3に固定された反射ミラーである。

第3図は、本実施例の露光装置のXYステージ

およびョイングセンサーであり、7は鏡筒支持体 4に固定された原点位置出し用レーザ、8はトッ ブステージ9上に配置された二次元センサーであ る。原点位置出し用レーザ7と二次元センサー8 とは1組み以上設置する。

9は X ステージ1 0上に取付けられて方向、 θ 方向、 α および β 方向に移動および回転する方向に移動および回転と方向に移動する。 1 0 は X 方向に移動可能な X ステージである。 1 0 は X 方向に移動可能な X ステージ、 1 1 は Y 方向に移動 Y ステージ 1 0 およ ステージ 1 0 およ ステージ 2 な ステージ 3 な Y ステージ 9 ~ 1 2 を 支持する X Y ステージ 9 ~ 1 2 を 支持する X Y ステージ 9 ~ 1 2 を 支持する X Y ステージ 9 ~ 1 2 を 支持する X Y ステージ m により 生かった ない 最 動を 防 振させかった の 最 動を を と呼ばれる X Y ステージ m スト 1 4 は 一般 的 に アクティブマウント 1 4 は 一般 ウェイブマウント 1 4 は 一般 の に アクティブスト

15は投影レンズ3とXYステージとの相対位置を計測しかつXYステージの姿勢を計測するためのレーザー干渉測定器、16aは投影レンズ3

用マウントいわゆるアクティブマウント (第1図 の付番14) の詳細図である。

同図において、31はXYステージ用定盤13に対しXY方向に力を作用させるボイスコイルモータ、32は2方向(紙面の上下方向)の剛性が高くかつXY方向に対しては剛性が低いエア・ウント上に固定はれたXY方向に関セが高く2方向に剛性が低いエア・ウント33の内圧をコントロールするサーボバルブ、37は固定体に38はXYステッグ用定盤13の傾きを検知する非接触タイプの変位計である。

第4図は、本実施例の露光装置のステージおよび X Y ステージ用マウント 部制御系のプロック図である。

同図において、41はXYステージのステップ 量および移動速度並びにステージ移動後のステー ジ定盤の傾きに対応するエアマウントの空気圧を 記憶し、各ドライバーへの動作命令を発信し、さ

らに所要ステップ量および移動速度に基づき、瞬 間瞬間のステージの位置速度にフィードバックを かける制御コンピューターである。42は第1図 の原点位置出し用レーザ7と二次元センサ8に相 当する原点位置出し部、43は外部から入力され るショット配列情報、44は第2図に示したXY 位置計測およびヨーイング計測のためのレーザ測 定システムである。45はXY方向のDCサーボ モータ46 (第1図の付番17, 18) を駆動す る X Y サーポドライバ、 4 7 はトップステージで ある。48はアクティブダンパコントローラで、 サーポパルブ49(第3図付番36)を制御する エアーマウント圧力コントローラとポイスコイル モータ50(第3図付番31)を駆動するポイス コイルモータドライバとからなる。51はステー ジ定盤13上に取付けられた加速度計、52はX Yステージ用定盤13の傾きを検知する非接触タ ィブの変位計(第3図付番38)、53はフォー カス検出部 (第1図付番16a, 16b) であ **5**.

次に、フォーカス検出部53およびステージの位置および姿勢を表わすレーザ測定システム44からのデータと制御用コンピュータ41内に記憶してある所定レイアウトとの差分である6ピッチとイング)、α(ローリング)およびβはして、XY成分に関してはトップステージ47を所定レイアウト(位置・姿

次に、これらの第1~4図を参照して本実施例の露光装置の動作を説明する。

まずはじめに、本体とXYステージの相対位置 および姿勢を計削するための原点を、鏡筒支持体 4に固定されたレーザーヘッド21からのレーザ 一光とトップステージ9上に配置された二次元セ ンサー8により決定する。これ以降、本体リセッ ト命令が制御用コンピュータに入力されるまで本 原点は書き換えられない。

次に、露光すべき半導体クエハ毎にショット配列(レイアウト)およびXY方向の移動量を予りとは、これらのデータおよびステージの移動荷重よりステージ移動後のステージを動きないである。別個を求めその傾きを補正すべく各マックを対していまたび速度サーボと位置決めサーボ切換え位置を計算し設定する。

そして、 X Y ステージのサーポドライバ 4 5 に 対し D C サーポモータ 4 8 の駆動指令を行ない、 アクティブダンパコントローラ 4 8 内の圧力コン

勢)と一致するように駆動する。

ここでα成分およびβ成分に関しては、そのデータを制御用コンピュータ41にフィードバックして、ステージの位置と傾きの関係のテーブルを 巻き換える。

このようにXYステージの位置決めが完了した 後に露光を行なう。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、XYステージと本体構造体とを別々に配置し、XYステージ用マウントにアクティブダンパと簡略フィードフォワード適用したオートレベラーを組合わせるという簡単な構造により、アクティブダンパを小型化しコスト低減が可能となる。また、本体構造体から振動源を排除することにより、構造体をコンパクトにでき軽量化がはかれる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例に係る露光装置 (ステッパ)の正面図、

第2図は、上記実施例の装置の測定系の配置を

示す斜視図、

 $\mathcal{A}^{\mathcal{F}}$

第3図は、上記実施例の装置のステージ用マウントの詳細な構造を示す断面図、

第4図は、上記実施例の装置のステージおよび

マウント部制御系のブロック図、

第5図は、従来の露光装置の正面図である。

1:照明部、 3:投影レンズ、

4:鏡筒支持体、5:本体用エアーマウント、

6:位置決め定盤、9:トップステージ、

10: X ステージ、11: Y ステージ、

14: XYステージ用マウント (アクティブダ

ンパー)、

41:制御用コンピュータ、

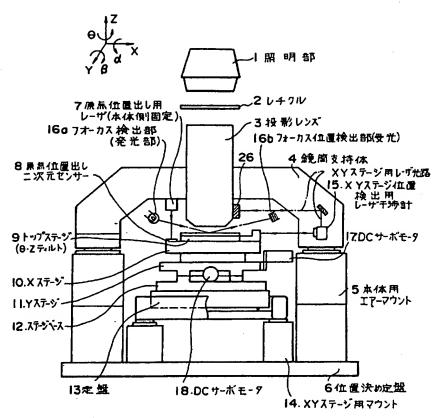
4 4 : X Y 位置計測 8 よび 3 ー イ ン グ 計 測 用 レ

ーザー測定システム、

45: XYサーポドライバ、

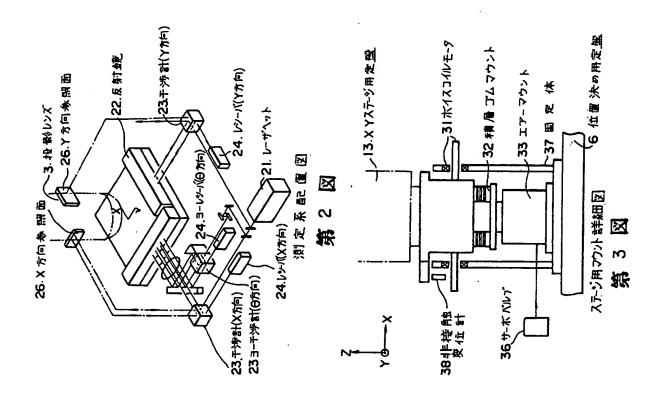
48:アクティブダンパコントローラ、

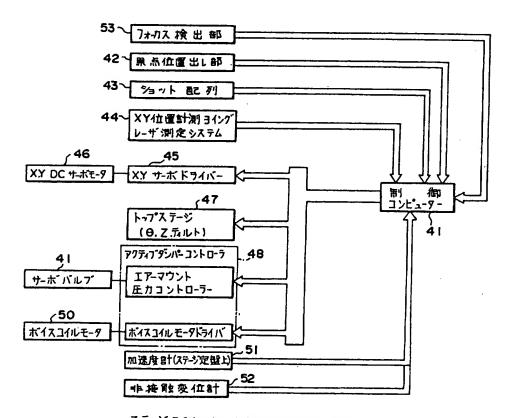
51:加速度計、52:非接触变位計。



本発明全体図

第一図





ステージ&びマウント部制御系ブロック図

第 4 図

